

| | ⊙ Saal1 | ⊙ Großer Saal | ⊙ Saal2 |
|---------------|--|---|--|
| 08:15-09:00 | Registrierung/Besuch der Ausstellung | | |
| 09:00-09:30 | Keynote: Graphical System Design - It Starts with Prototyping Greg Crouch, National Instruments Corp. | | |
| 09:30-10:30 | New Product & Technology Introduction Günther Stefan, Daniel Riedelbauch, Christoph Landmann, National Instruments Austria/Germany | | |
| ⌚ 10:30-11:00 | Kaffeepause/Besuch der Ausstellung | | |
| | Industrielle Datenerfassung und Signalkonditionierung | Anwendungsentwicklung, Tipps & Tricks | Automatisierte Prüfsysteme |
| 11:00-11:30 | Moderne Datenerfassungsarchitekturen Andreas Scholz, National Instruments Germany GmbH | Leistungs- & Geschwindigkeitssteigerung von LabVIEW-Projekten Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH | Von Beginn an erfolgreich: Der mühelose Umstieg auf NI LabVIEW Real-Time und FPGA Sascha Egger, National Instruments Switzerland Corp. |
| 11:30-12:00 | Einzelmodulprüfstand für zehn Photovoltaikmodule zur Vermessung des Betriebswirkungsgrades und des Betriebsverhaltens Prof. Dr. Peter Zeller, FH Oberösterreich/ Fakultät Wels | Netzwerkcommunicationstechniken in NI LabVIEW Daniel Riedelbauch, National Instruments Germany GmbH | Entwicklung neuer sensorloser Regelungsstrategien für elektrische Antriebe unter Anwendung eines kombinierten Mess- und Regelungssystems Peter Nussbaumer, Dr. Markus A. Vogelsberger, TU Wien |
| 12:00-12:30 | Wireless-Sensornetzwerke Sascha Egger, National Instruments Switzerland Corp. | Wissenswertes für das Erstellen von Benutzeroberflächen in NI LabVIEW Christoph Landmann, National Instruments Germany GmbH | Messung der Auswirkungen von ionisierender Strahlung auf CMOS-Schaltungen Michael Hofbauer, Kurt Schweiger, TU Wien |
| ⌚ 12:30-13:30 | Mittagspause/Besuch der Ausstellung | | |
| | Industrielle Datenerfassung und Bildverarbeitung | Versuchssteuerung und technisches Datenmanagement | Automatisierte Prüfsysteme |
| 13:30-14:00 | The Future of Condition Monitoring: Prognostics Systems Using COTS Technologies Lodovico Menozzi, National Instruments Italy | Die Plattform NI CompactRIO und ihre Neuerungen Paul Schmitzberger, National Instruments Austria | Hardware-compatible Waveform Compression for Use on LabVIEW FPGA Benjamin Steinwender, MSc Kompetenzzentrum Automobil- und Industrie-Elektronik GmbH |
| 14:00-14:30 | Realisierung eines OCR-Systems im Stahlwerk Oliver Sidla, SLR Engineering | CompactRIO-basierte Regler für servohydraulische Prüfzylinder Klaus Sobe, Dr. Thomas Thurner, TU Graz | Neuerungen für automatisierte Testsysteme mit PXI Helmut Wurm, National Instruments Austria |
| 14:30-15:00 | Grundlagen der Leistungsmessung Marco Brauner, National Instruments Germany GmbH | DIAdem und LabVIEW Real-Time als Basis für ein universelles Prüfstandskonzept in der Dauererprobung Holger Müller, a-solution | Vorteile softwaredefinierter RF-Testsysteme Christian Gindorf, National Instruments Germany GmbH |
| ⌚ 15:00-15:30 | Kaffeepause/Besuch der Ausstellung | | |
| | LabVIEW-Zertifizierung | Industrial Measurement & Control | Automatisierte Prüfsysteme |
| 15:30-16:00 | CLAD-Zertifizierung | Grundlagen der Motorsteuerung mit NI LabVIEW Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH | Die Herausforderungen analoger Messtechnik mit bis zu 12,5 GS/s bewältigen Marco Brauner, National Instruments Germany GmbH |
| 16:00-16:30 | | Steuerung einer Galvanisierungsanlage mit LabVIEW Johannes Prodingner, Hunyadi Technisches Büro für technische Chemie | Burn-in Test zur Voralterung von elektronischen Baugruppen Marco Weidmann, ad+ AG |
| ⌚ 16:30-17:30 | Stehempfang/Besuch der Ausstellung | | |